

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1 ноября 2006 г.

9:00 – 14:00	РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 14:30	ОТКРЫТИЕ VII Международного семинара «Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии – 2006»
14:30 – 16:00	<i>Председатель: член-корр. НАН Беларуси Плескачевский Ю. М.</i>
14:30 – 14:50	<i>Свириденко А. И.</i> (Гродно, Беларусь) Актуальные проблемы применения СЗМ в Беларуси
14:50 – 15:10	<i>Жавнерко Г. К., Агабеков В. Е.</i> (Минск, Беларусь) Метод микроконтактной печати, локальная модификация поверхности и интерпретация данных сканирующей зондовой микроскопии
15:10 – 15:30	<i>Брич М. А., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь) Моделирование взаимодействия углеродной нанотрубки, как зонда АСМ, с кристаллом алмаза
15:30 – 15:45	<i>Миронов В. Л., Грибков Б. А., Никитушкин Д. С., Фраерман А. А.</i> (Нижний Новгород, Россия) Магнитно-силовая микроскопия ферромагнитных наночастиц
15:45 – 16:00	<i>Миронов В. Л., Никитушкин Д. С., Грибков Б. А., Гусев С. А.</i> (Нижний Новгород, Россия) Магнитно-силовая микроскопия слабокоэрцитивных ферромагнитных наночастиц
16:00 – 16:30	ПЕРЕРЫВ
16:30 – 18:10	<i>Председатель: Жавнерко Г. К.</i>
16:30 – 16:50	<i>Чижик С. А., Шкадаревич А. П., Кузнецова Т. А., Курганович А. М.</i> (Минск, Беларусь) Контроль поверхностей лазерной оптики методом АСМ
16:50 – 17:10	<i>Berezina S., Zinin P., Koehler B.</i> (Жилина, Словакия) Nondestructive characterization of thick DLC-films
17:10 – 17:30	<i>Ясинский В. М., Ивакин Е. В., Суходолов А. В., Хайруллина А. Я., Кокиц А. Н.</i> (Минск, Беларусь) Исследование особенностей возбуждения плазмон-поляритонов в периодически наноструктурированных металлических пленках методом фотонной сканирующей туннельной микроскопии
17:30 – 17:50	<i>Сошников А. И., Гоголинский К. В., Решетов В. Н.</i> (Троицк, Россия) Исследование с помощью СЗМ «Наноскан» свойств области контакта токопроводящих алмазных зондов с поверхностью
17:50 – 18:10	<i>Kukharenko L. V., Fuchs H., Leshchenko V. G., Gelis L. G., Lazareva I. V.</i> (Минск, Беларусь) Surface morphological change investigation in surface activated platelets with the scanning force microscope

2 ноября 2006 г.

9:00 – 11:00	<i>Председатель: Миронов В. Л.</i>
9:00 – 9:20	<i>Плескачевский Ю. М., Суслев А. А., Чикунов В. В., Цуан Янь, Чижик С. А.</i> (Минск, Гомель, Беларусь) Самоорганизация поверхностных слоев твердых покрытий при трении
9:20 – 9:40	<i>Wielgo K., Ekwińska M., Rymuza Z.</i> (Варшава, Польша) Nanoindentation studies of oxynitride ultrathin films for MEMS applications
9:40 – 10:00	<i>Pustan M., Rymuza Z.</i> (Варшава, Польша) Scale effect on mechanical properties of movable MEMS structures tested by AFM
10:00 – 10:20	<i>Балабанова Н., Чикунов В. В., Римуза З.</i> (Варшава, Польша; Минск, Беларусь) Влияние сонорных осцилляций и топографии поверхности на адгезионные свойства полимерных покрытий
10:20 – 10:40	<i>Koszewski A., Gorski T., Rymuza Z.</i> (Варшава, Польша) Estimation of Young's modulus of ultrathin polymeric films for nanoimprint lithography by use of AFM
10:40 – 11:00	<i>Chizhik S. A., Vo Thanh Tung, Chikunov V. V., Nguyen Tho Vuong, Tran Xuan Hoai</i> (Минск, Беларусь; Вьетнам) Interactions of quartz tuning fork of atomic force microscope operating under shear-force and tapping modes
11:00 – 11:30	ПЕРЕРЫВ

11:30 – 13:10	Председатель: Ясинский В. М.
11:30 – 11:50	<i>Игнатовский М. И.</i> (Гродно, Беларусь) К вопросу о применении зондовой микроскопии для исследования полимерных композитов
11:50 – 12:10	<i>Романюк В. Л., Гременок В. Ф., Меркулов В. С., Залесский В. Б., Ермаков О. В., Чигирь Г. Г., Сякерский В. С., Абетковская С. О.</i> (Минск, Беларусь) Исследование морфологии поверхности тонких сегнетоэлектрических пленок $Ba_xSr_{1-x}TiO_3$ с помощью атомно-силового микроскопа
12:10 – 12:30	<i>Гончарова О. В., Гременок В. Ф., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь) Применение сканирующей зондовой микроскопии для исследования влияния толщины пленочных слоев сульфида индия на их структуру
12:30 – 12:50	<i>Пилипенко В. А., Петлицкая Т. В., Чижик С. А., Кузнецова Т. А.</i> (Минск, Беларусь) Исследование топологии интегральных микросхем методом атомно-силовой микроскопии
12:50 – 13:10	<i>Сыроежкин С. В., Журавский В. С., Губанов А. В., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь) Многоуровневая реконструкция АСМ-изображений
13:10 – 13:30	<i>Артамонов В. В., Алексеенко А. А., Бойко А. А., Подденежный Е. Н.</i> (Гомель, Беларусь) Применение метода СЗМ для анализа структурных особенностей гель-стекол и керамики
13:30 – 14:30	ОБЕД
14:30 – 15:45	Председатель: Суслов А. А.
14:30 – 14:50	<i>Довбешко Г. И., Фесенко О. М.</i> (Киев, Украина) Структура и свойства металлических наноповерхностей, усиливающих оптические сигналы
14:50 – 15:10	<i>Дубравин А. М.</i> (Гомель, Беларусь) Моделирование динамического контакта Зонд–Образец
15:10 – 15:25	<i>Абетковская С. О., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь) Влияние упругих и адгезионных свойств образца на его контактное деформирование и фазовый контраст в динамическом режиме АСМ
15:25 – 15:40	<i>Бондаренко М. А., Шевченко Ю. Б., Бойко В. П., Коваленко Ю. И., Яценко И. В., Канашевич Г. В., Ващенко В. А.</i> (Черкассы, Украина) Исследование микрогеометрии поверхности оптических стекол после электронной и после лазерной обработки методом атомно-силовой микроскопии
15:40 – 15:55	<i>Бондаренко М. А., Бондаренко Ю. Ю., Бабаев А. К., Яценко И. В., Рева И. А., Конопальцев Л. И., Ващенко В. А.</i> (Черкассы, Украина) Применение метода атомно-силовой микроскопии в прогнозировании срока эксплуатации пьезоэлектрических преобразователей медицинских приборов
15:55–16:15	ПЕРЕРЫВ
16:15 – 17:35	Председатель: Кухаренко Л. В.
16:15 – 16:35	<i>Стародубцева М. Н., Кузнецова Т. Г., Егоренков Н. И.</i> (Гомель, Беларусь) АСМ исследование эритроцитов, кренированных активными формами азота
16:35 – 16:55	<i>Кузнецова Т. Г., Стародубцева М. Н., Егоренков Н. И.</i> (Гомель, Беларусь) Определение механических свойств клеточных поверхностей
16:55 – 17:15	<i>Слобожанина Е. И., Козлова Н. М., Ясинский В. М., Филимоненко Д. С., Хайруллина А. Я.</i> (Минск, Беларусь) Исследование Zn-индуцированных изменений в эритроцитарных мембранах методом атомно-силовой микроскопии
17:15 – 17:35	<i>Трушко А. В., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь) АСМ анализ хрящевых тканей

3 ноября 2006 г.

10:00 – 11:15	Председатель: Меркулов В. С.
10:00 – 10:20	<i>Джилавдари И. З., Какошко Е. Ю.</i> (Минск, Беларусь) Исследование упругих растяжений и диссипации энергии на поверхности кристалла методом микродеформаций под действием качающегося шарика
10:20 – 10:40	<i>Айзикович С. М., Кренив Л. И., Трубчик И. С.</i> (Ростов-на-Дону, Россия) Статическое исследование механических свойств функционально-градиентных покрытий при воздействии с поверхности
10:40 – 11:00	<i>Шпица Н. А.</i> (Минск, Беларусь) Исследования поверхности сканирующим датчиком Кельвина
11:00 – 11:15	<i>Циркунова Н. Г., Борисенко В. Е.</i> (Минск, Беларусь) Геометрия зондовой микроскопии: Влияние радиуса закругления зонда на точность формируемого изображения
11:15 – 11:45	ПЕРЕРЫВ

11:45 – 13:00	<i>Председатель: Чижик С. А.</i>
11:45 – 12:10	<i>Киселева О. И.</i> (Москва, Россия) Новое оборудование компании Veeco для исследования свойств полупроводниковых материалов на наноровне
12:10 – 12:35	<i>Малиновская О. С.</i> (Москва, Россия) Исследование нанотрубок и других углеродных наноструктур с помощью сканирующего туннельного микроскопа НТК «Умка»
12:35 – 13:00	<i>Суслов А. А., Шашолко Д. И.</i> (Гомель, Беларусь) Использование программного пакета «SurfaceXplorer» для обработки, визуализации и анализа СЗМ-изображений
13:00 – 14:00	КРУГЛЫЙ СТОЛ
14:00 – 14:30	ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

СТ 1	<i>Дубравин А. М., Комков О. Ю.</i> (Гомель, Беларусь) Контролируемое перемещение наночастиц по поверхности подложки в режиме кратковременного контакта зонда с поверхностью образца
СТ 2	<i>Дубравин А. М., Комков О. Ю., Yoop Eui-Sung</i> (Гомель, Беларусь; Сеул, Корея) Формирование нанорельефа при локальном окислении поверхности кремния с помощью атомно-силового микроскопа
СТ 3	<i>Дубравин А. М., Комков О. Ю., Браилко Н. Н.</i> (Гомель, Беларусь) Некоторые особенности АСМ изображений и их коррекции
СТ 4	<i>Барайшук С. М., Верес О. Г., Ташлыков И. С.</i> (Минск, Беларусь) Топография и свойства поверхности изделий, модифицированных ионно-ассистированным осаждением покрытий
СТ 5	<i>Чапланова Ж. Д., Михайловский Ю. К., Агабеков В. Е., Ольховик В. К., Галиновский Н. А., Грачева Е. А.</i> (Минск, Беларусь) Изучение морфологии термонапыленных тонких бензоксазолевых производных бифенила методом сканирующей зондовой микроскопии
СТ 6	<i>Игнатовский М. И., Свириденко А. И., Смуругов В. А., Ховатов П. А., Чмыхова Т. Г.</i> (Гродно, Гомель, Беларусь) Влияние нанонаполнителей на картину износа поверхности стали в субмикронном диапазоне
СТ 7	<i>Kukharensko L. V., Koshikawa T., Aleinikova O. V., Shman T. V., Krylov A. B., Ivanov A. A., Tsirkunova N. G.</i> (Минск, Беларусь) Combination of confocal laser scanning microscopy with scanning force microscopy for K562 cells study
СТ 8	<i>Chizhik S. A., Vo Thanh Tung, Chikunov V. V., Nguyen Tho Vuong</i> (Минск, Беларусь; Вьетнам) Influence of additional mass on quartz tuning fork in dynamic operation mode
СТ 9	<i>Торская Е. В., Горячева И. Г., Чижик С. А., Сыроежкин С. В.</i> (Москва, Россия; Минск, Беларусь) Определение толщины упругого слоя на твердой подложке методом статической силовой спектроскопии
СТ 10	<i>Кузнецова Т. А.</i> (Минск, Беларусь) Применение атомно-силовой микроскопии в методах индентирования
СТ 11	<i>Kotov D. A., Dubkova V. I.</i> (Минск, Беларусь) Application of atomic force microscopy for study of modified carbon fiber surface
СТ 12	<i>Шилько С. В., Хиженок В. Ф., Абетковская С. О., Плескачевский Ю. М.</i> (Гомель, Минск, Беларусь) Атомно-силовая микроскопия поверхности деталей искусственного клапана сердца
СТ 13	<i>Жданок С. А., Крауклис А. В., Самцов П. П., Кузнецова Т. А., Полевиков В. М., Чижик С. А.</i> (Минск, Гомель, Беларусь) Атомно-силовая микроскопия поверхности стали, модифицированной углеродными нанотрубками